

被污染Au-Si表面势垒探测器性能的恢复方法

@丁洪林\$中国原子能科学研究院!北京

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 <正> 金硅面垒半导体探测器是带电粒子能谱测量和 α,β 放射性强度测量的重要探测元件。这种探测器具有近似理想的伏安特性、噪声低、入射窗薄、线性好、脉冲上升时间短,能量分辨好等优点;另外又能做成各种几何形状如园形、矩形、环形、条带阵列以及探测器耗尽厚度可根据工作需要直接制备出厚为几微米到几毫米的全耗尽探测器;还可通过较灵

关键词 [金硅面垒](#) [探测器](#)

分类号

RECOVERY OF PERFORMANCE OF Au-Si SURFACE BARRIER DETECTOR CONTAMINATED

DING HONGLING China Institute of Atomic Energy, P. O. Box 275, Beijing

Abstract

Key words

DOI

通讯作者

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(88KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“金硅面垒”的 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)